# XRR 解析レポート

#### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

#### 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004

オフセット=0.000e+000

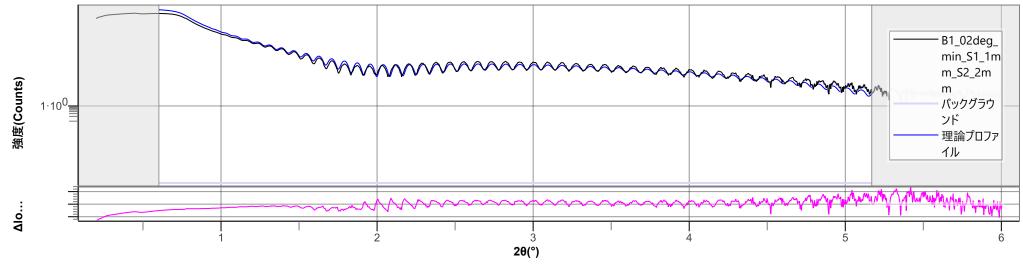
フィッティング手法: Nelder-Mead データ間隔:1点ごとにフィッティング

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

### プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		────密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>	
$\checkmark$	L3	Fe2O3	0.006	Const	1.00000	Const		Con
	LS		±0.04 最小←	精密化	±2 最 <b>小</b> ←	精密化	±0.03最小←	精密化
<b>✓</b>	L2	** Fe2O3	2.496	Const	4.95000	Const	0.000	Con
	LZ		±0.5	精密化	±0.05	→最大 精密化	±0.015最小←	精密化
$\checkmark$	L1	Fe Fe	93.029	Const	7.73090	Const	0.000	Con
	LI		±0.06	精密化	±0.06	精密化	±0.04最小←	精密化
$\checkmark$	基板	<b>⊡</b> Si	∞		2.32924	Const	0.500	Con